

Книга представляет собой четвертый том периодического издания «Физика тонких пленок»; первые два тома вышли в свет в русском переводе в 1967 г., третий — в 1968 г.

В данный том вошли шесть обзорных статей ведущих иностранных специалистов. Три статьи посвящены фундаментальным вопросам образования кристаллических пленок. В них дан анализ важнейших методических, экспериментальных и теоретических работ по этим проблемам. В обзоре, посвященном стекловидным пленкам, изложено современное состояние исследований физических и физико-химических свойств и методов получения таких пленок, которые приобрели важное значение в «твердолительной» электронике. В двух других статьях рассматриваются прохождение горячих электронов в слоистых системах через металлические пленки и методические вопросы прецизионных измерений оптических свойств тонких пленок. Все обзоры могут служить практическими руководствами по указанным выше проблемам.

Книга рассчитана на широкий круг лиц, интересующихся вопросами физики твердого тела, и особенно физики тонких пленок и применением тонких пленок. Она представляет несомненный интерес для специалистов, работающих в области тонкопленочной электроники и в ряде других областей (полупроводниковая электроника, вакуумная техника, оптика и т. д.).

